



Acoblaments tèrmics en circuits mixtes [aplicacions al test de circuits integrants /

Altet Sanahujes, Josep

Universitat Politècnica de Catalunya,
1999

Monografia

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMjEwMTE1NDI>

Título: Acoblaments tèrmics en circuits mixtes Microforma] aplicacions al test de circuits integrants Josep Altet Sanahujes ; director, J. Antonio Rubio Sola

Editorial: Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya 1999

Descripción física: 1 microficha (fotogramas) negativo 11x15cm + 1 folleto

Mención de serie: Tesis doctoral / Universidad Politècnica de Catalunya TD-154/99

Tesis: Tesis-Universidad Politècnica de Catalunya, Departamento de Ingeniería Electrónica, 1998

ISBN: 8476537263

Materia Entidad: Universitat Politècnica de Catalunya. Departamento de Ingeniería Electrónica- Tesis y disertaciones académicas- Microfichas

Materia: Microformas- Tesis y disertaciones académicas Circuitos integrados- Tesis y disertaciones académicas- Microfichas

Autores: Rubio, Antonio (1954-), dir

Entidades: Universitat Politècnica de Catalunya ed. Universitat Politècnica de Catalunya. Departamento de Ingeniería Electrónica

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es